

プレートリーダー基礎講座(全3回) ～見落としがちな「測定のコツ」お教えします～

講演：テカンジャパン株式会社

開催日：2026年 3月18日(水) 13:00～14:00 《入退室自由》

参加申し込み締切日：2026年 3月16日(月) 17:00まで

申込URL：<https://forms.office.com/r/K6QeXdE2XA>

開催形式：Microsoft Teams

右のQRコードから申し込みへアクセス
皆さまのご参加お待ちしております！



第1回

装置の中では何が起きている?? ～光学系の解剖学と全測定機能の基礎～

分光器の構造や検出器（PMT等）の特性など、ハードウェアの基礎を徹底解説。
フィルター式とモノクロメーター式の決定的な違いや、
測定モードごとの原理・注意点を丁寧に紐解きます。

日々、プレートリーダーを使って多くのデータを取得されている中で、

原因不明のデータの
バラつきや、
異常値の判断に困っている



Tecan社 マイクロプレートリーダーSpark®

装置のStartボタンを
押したあと、
中で何が起きているか
実はよく知らない

……といった現場ならではのお悩みはございませんか？

本ウェビナーでは、ブラックボックスになりがちなプレートリーダーの測定プロセスを可視化し、
「明日からの実験に自信が持てる」実践的なナレッジを3回シリーズでお届けします。

第1回 本講演

装置の中では何が起きている?? ～光学系の解剖学と全測定機能の基礎～

日時：2026年3月18日 13:00-14:00
分光器の構造や検出器（PMT等）の特性など、
ハードウェアの基礎を徹底解説。
フィルター式とモノクロメーター式の決定的な違いや、
測定モードごとの原理・注意点を丁寧に紐解きます。

第2回

全測定モードを網羅、 実践的な測定のコツとトラブルシュート ～「設定のミス」か「装置の不調」かを見極める～

日時：5・6月中に実施予定
数値のばらつきや感度不足の回避方法を伝授。
エラー発生時に役立つ「トラブルシュート・フロー」を公開し、
迷わず対処できるスキルを身につけます。

第3回

正しいデータを得るための最後の壁 ～ラボウェアの選択と装置QC（品質管理）～

日時：5・6月中に実施予定
プレートの物理特性が光に与える影響を解説。
アッセイに最適なプレート選定法と、装置の「健康診断（QC）」を
自分で行うためのセルフチェック方法をお伝えします。